

OSK 75GQ M5000 金属分析装置（発光分光分析装置）

CCDテクノロジーを用いた金属分析用の分光計です。

堅牢な構造と便利な操作や高い信頼性により、世界各国で親しまれております。

プログラム可能なデジタルスパーク源、自動校正の技術により、早くて信頼出来る結果を得ることができます。


ISO 9001の認証の取得あり



【特長】

- 高性能で低価格
- コンパクト設計の卓上型
- 干渉補正によるグローバル工場校正
- 分光計温度制御による高精度と安定性
- 待機電力100VA、真空ポンプ不要の省エネ設計
- 簡素化された操作ソフトウェアにより、使いやすい
- 波長範囲140nm-680nm、より多くの元素の分析が可能
- 最適化された性能、二重光学系設計、C、P、S、Nの分析が可能
- 特注なQC機能とグレード識別機能により、未知の材料を簡単に分類
- インテリジェントなデータキャプチャ、バックグラウンド干渉の低減による精度の向上
- アルゴンパーージ制御により、入りロレンズを汚染から保護し、メンテナンスを最小限に抑え
- 完全な波長範囲、特注な工場校正、それ以上のハードウェア構成なしで新しい要素が加わる

【製品仕様】	OSK 75GQ M5000
ベース	Fe、Al、Cu zn、Ni、Ti、Mg、Coなどの関連塩基に対応。
光学系	<ul style="list-style-type: none">• 全波長をカバーするパッシェンレンジ光学系• 有効波長範囲140nm～680nm• 高分解能マルチCCD検出器を用いる• デュアル光学系デザイン、オプションのUV光学系 

校正	<ul style="list-style-type: none"> 標準的な工場校正手順 自由に選択できる分析プログラム 個々の要求に応じて特注な校正プログラム
発光スタンド	<ul style="list-style-type: none"> アルゴンフラッシュと最適化されたアルゴンフロー - 様々な試料形状に適用する簡単操作の試料クランプ 耐久性に優れた電極と容易なメンテナンス 操作簡単な小型サンプルクランプ 
読み出しシステム	<ul style="list-style-type: none"> 高性能DSPと超高速FPGAプロセッサ 外部PCオプション イーサネットデータ伝送
励起光源	<ul style="list-style-type: none"> プログラマブルパルスデジタルソース 最適化されたエレクトロニクスと完全な励磁保護 スパーク、アーク、複合放電波形を様々なベースで使用可能 高エネルギープリスパーク 周波数 100Hz&1000Hz 最大放電電流：400A
ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> Windowsベースの使いやすいグラフィックインターフェース 自動診断システム データベース管理 Microsoft Windowsオペレーティング装置
電気的および環境的要件	<ul style="list-style-type: none"> スパーク時最大400VA 平均待機電力 50VA - 室温：10 0°C-v30 0°C e 相対湿度：20%-80%
寸法	<ul style="list-style-type: none"> 長さ×幅×高さ：726×622×546mm 正味重量：80kg

モデル	波長	説明
OSK 75GQ M5000 F	140-680 nm	C,P,S,N分析に最適化されたパフォーマンス。Fe、Al、Cu、Zn、Ni、Ti、Mg、Coなどの塩基に対応。
OSK 75GQ M5000 N	170-680 nm	分析用に最適化されたパフォーマンス。Fe、Al、Cu、Zn、Ni、Ti、Mg、Coなどの塩基に対応。
OSK 75GQ M5000 S	200-680 nm	Al、Mg、Cu、Zn、Ni、Tiの塩基に使用可能